

Ref #	Hits	Search Query	DBs	Default Operator	Plurals	Time Stamp
L2	229	probe and curvature and test and mu	USPAT	OR	OFF	2005/05/27 06:37
L3	110	2 and semiconductor	USPAT	OR	OFF	2005/05/27 06:38
L4	47	probe and curvature and radius and test and 324/754-762.ccls.	USPAT	OR	OFF	2005/05/27 07:22
L10	1369	probe and curvature and radius and test	USPAT	OR	OFF	2005/05/27 07:22
L11	144	10 and micrometer	USPAT	OR	OFF	2005/05/27 07:23

US 6888344 B2 USPAT
US 6885204 B2 USPAT
US 6856152 B2 USPAT
US 6806723 B2 USPAT
US 6784680 B2 USPAT
US 6756791 B1 USPAT
US 6741086 B2 USPAT
US 6724199 B1 USPAT
US 6717419 B1 USPAT
US 6714030 B2 USPAT
US 6710798 B1 USPAT
US 6667626 B2 USPAT
US 6646455 B2 USPAT
US 6633176 B2 USPAT
US 6583640 B2 USPAT
US 6578264 B1 USPAT
US 6529021 B1 USPAT
US 6275051 B1 USPAT
US 6242929 B1 USPAT
US 6198300 B1 USPAT
US 6184699 B1 USPAT
US 6175243 B1 USPAT
US 6127835 A USPAT
US 6069481 A USPAT
US 6019612 A USPAT
US 6016061 A USPAT
US 5966022 A USPAT
US 5909123 A USPAT
US 5896038 A USPAT
US 5888075 A USPAT
US 5886535 A USPAT
US 5767691 A USPAT
US 5673477 A USPAT
US 5613861 A USPAT
US 5574668 A USPAT
US 5541522 A USPAT
US 5500607 A USPAT
US 5489855 A USPAT
US 5475318 A USPAT
US 5406210 A USPAT
US 5214375 A USPAT
US 5164595 A USPAT
US 5072116 A USPAT
US 4980636 A USPAT
US 4973903 A USPAT
US 4544886 A USPAT
US 3599093 A USPAT